Search Notes			

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/849,743	MACNEILLE ET AL.	
Examiner	Art Unit	

3661

CUONG H. NGUYEN

	SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
701	300,213		
340	901,903		-
370	315+		
704	E19.02		
	E15.01		
	,		

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
		·	
	·		
		·	
	<u> </u>		

SEARCH N (INCLUDING SEARC	OTES CH STRATEG	<b>Y</b> )
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DATE	EXMR
WEST/DERWENT		
•		1
IEEE Xplore		
•		<u> </u>
Inventors'names search		
		<del>                                     </del>
		<del>                                     </del>
<del>-</del>	/	
, ·		